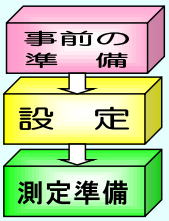
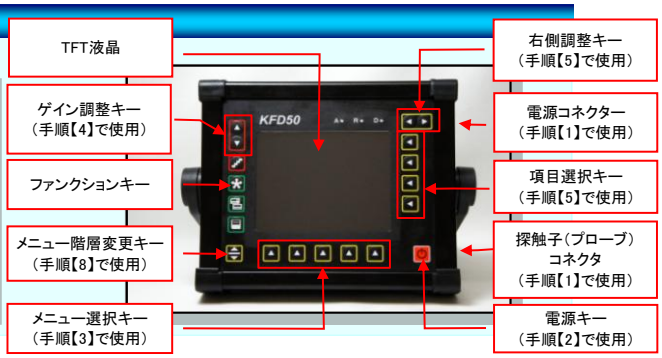
KFD50（垂直探傷）

製品案内　超音波探傷器　簡易取扱説明書　　測定範囲の調整方法

1 概要





2 事前の準備

1

KFD50（上部電源コネクター）とACアダプター、探触子コネクタと探触子（プローブ）をケーブルでそれぞれ接続する。

2

「電源」キーを押し電源を入れる。

KFD50（垂直探傷）

製品案内　超音波探傷器　簡易取扱説明書　　測定範囲の調整方法

設定 （メニュー構成） ※測定前に確認してください

3

：重要度：高
：重要度：低

＜メニュー：第1階層＞

基本		送信部		受信部		ゲート (a)		ゲート (b)	
測定範囲	125.0 mm	ダンピング	低	dBステップ	20.0 dB	ゲート評価	正	ゲート評価	オフ
音速	5900 m/s	送信出力	高	リジェクト	0%	a起点	30.00mm	b起点	80.00mm
ディレイ	0.00 uS	二探触子	オフ	受信周波数	2.0 - 20	a幅	20.00mm	b幅	50.00mm
0点調整	0.000 uS	AGC	80%	波形表示	全波	a高さ	10%	b高さ	10%

＜メニュー：第2階層＞

校正		JDAC		斜角		保存		データ	
基準路程1	25.00 mm	区分線	H	屈折角	0.0	保存番号	1	探傷情報	オフ
基準路程2	50.00 mm	DAC	オフ	入射点	0.00 mm	呼出	オフ	情報表示	オフ
a起点	30.00mm	DACエコ	0	スキップ	0	保存	オフ	保存情報	オフ
校正	オフ	a起点	40.00mm	板厚	10.00mm	削除	オフ	設定一覧	オフ
		感度調整	0.0 dB	外径	平面	全削除	オフ		
		区分幅	6.0 dB						

＜メニュー：第3階層＞

設定1		表示値		LCD		設定2		設定3	
ビーム路程	Jフランク	表示位置 1	Sa	強調表示	オフ	言語	日本語	評価モード	JISDAC
測定値表示	Sa	表示位置 2	Ha%	表示色	1	単位	mm	スクウエア	オフ
拡大ゲート	A	表示位置 3	Sb	ライト	0	ブザー	オフ		
Aスコープ	MA表示	表示位置 4	Hb%	グリッド	0	日付			
				スケール	測定値	時間			

※この設定は、ここで行う測定用です。測定に使用する試験片などの条件が変わる場合は、この表の設定も変更する必要が有ります。

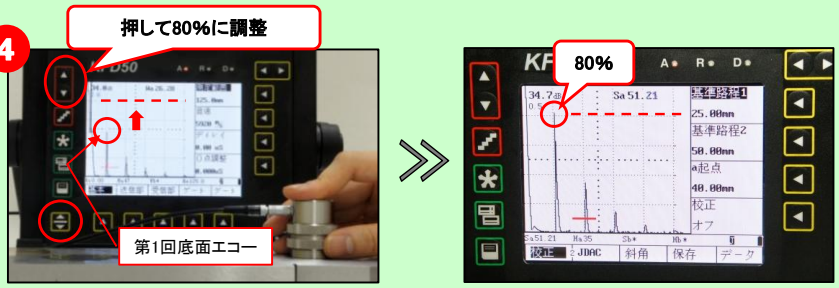
KFD50（垂直探傷）

製品案内　超音波探傷器　簡易取扱説明書　　測定範囲の調整方法

4 測定準備（測定範囲の調整）

ゲインの調整

4



「メニュー階層変更」キーを押し、校正メニューに切り替える。

STB-A1（25mm部）に接触媒質（カプラント）を少量塗布し、探触子（プローブ）を接触させる。

左上の「 」キーを押し第1回底面エコーを80%の高さに調整する。

校正

5

項目選択キーの「校正 」キーを2回押す。

「a起点」が選択されていて、校正項目に「基準1?」と表示されている事を確認し、「 」キーでゲートを第1回底面エコー上へ移動させる。

6

「校正 」キーを2回押す。

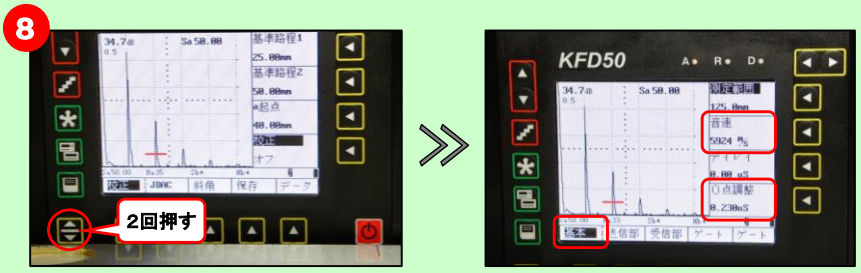
校正項目に「基準2?」と表示されている事を確認し、「 」キーでゲートを第1回底面エコー上から第2回底面エコー上へ移動させる。

7

「校正 」キーを2回押す。

校正項目に「オフ」の文字が表示され、校正が完了する。

8



「メニュー階層変更」キーを2回押し、基本メニューへ切り替える。
実際の『音速』『0点調整』の値を確認する。